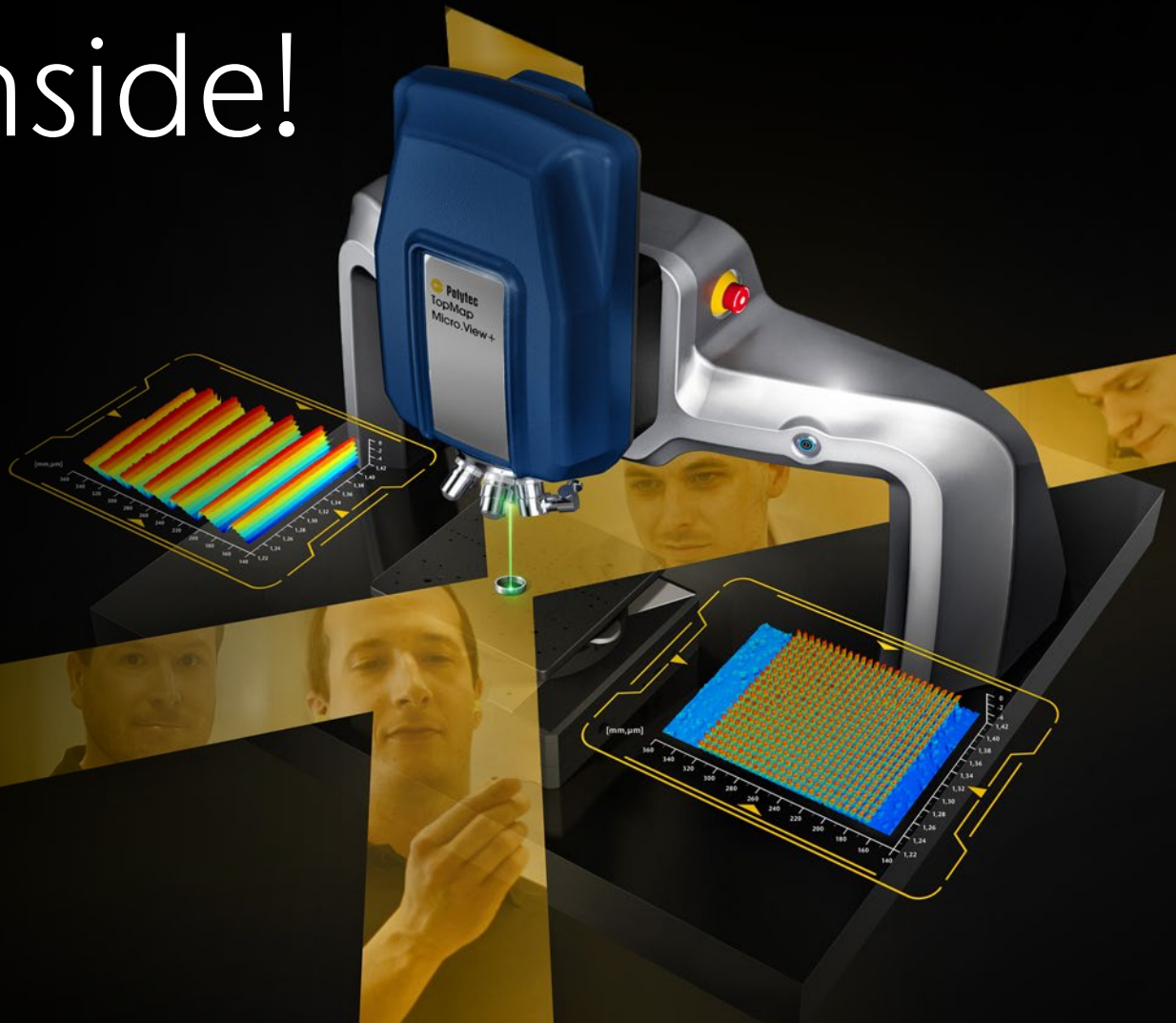


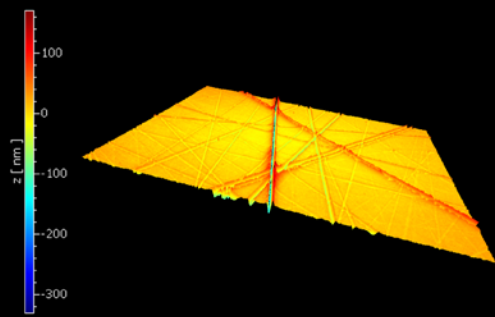
Polytec

Kundeninformation

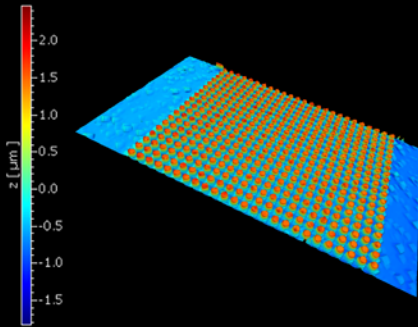
Xperts
inside!



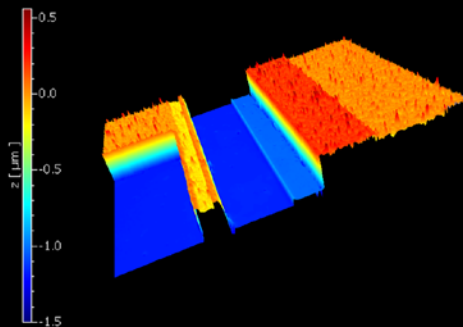
TopMap Micro.View[®] & Micro.View[®]+
Optische 3D-Oberflächenmesstechnik



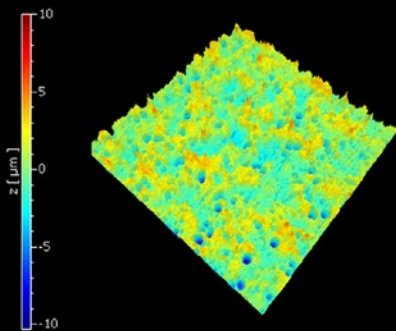
Oberflächenrauheit messen



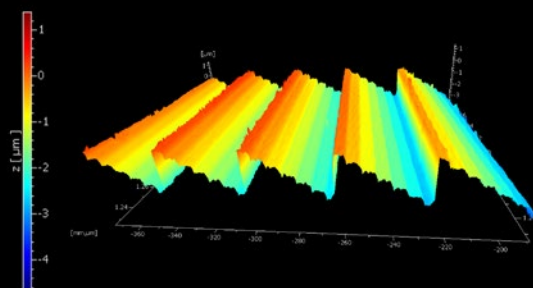
Mikrostrukturen analysieren



Wafer prüfen



Materialforschung & Tribologie



Optische Bauteile charakterisieren

Berührungsfreie Charakterisierung von Oberflächendetails

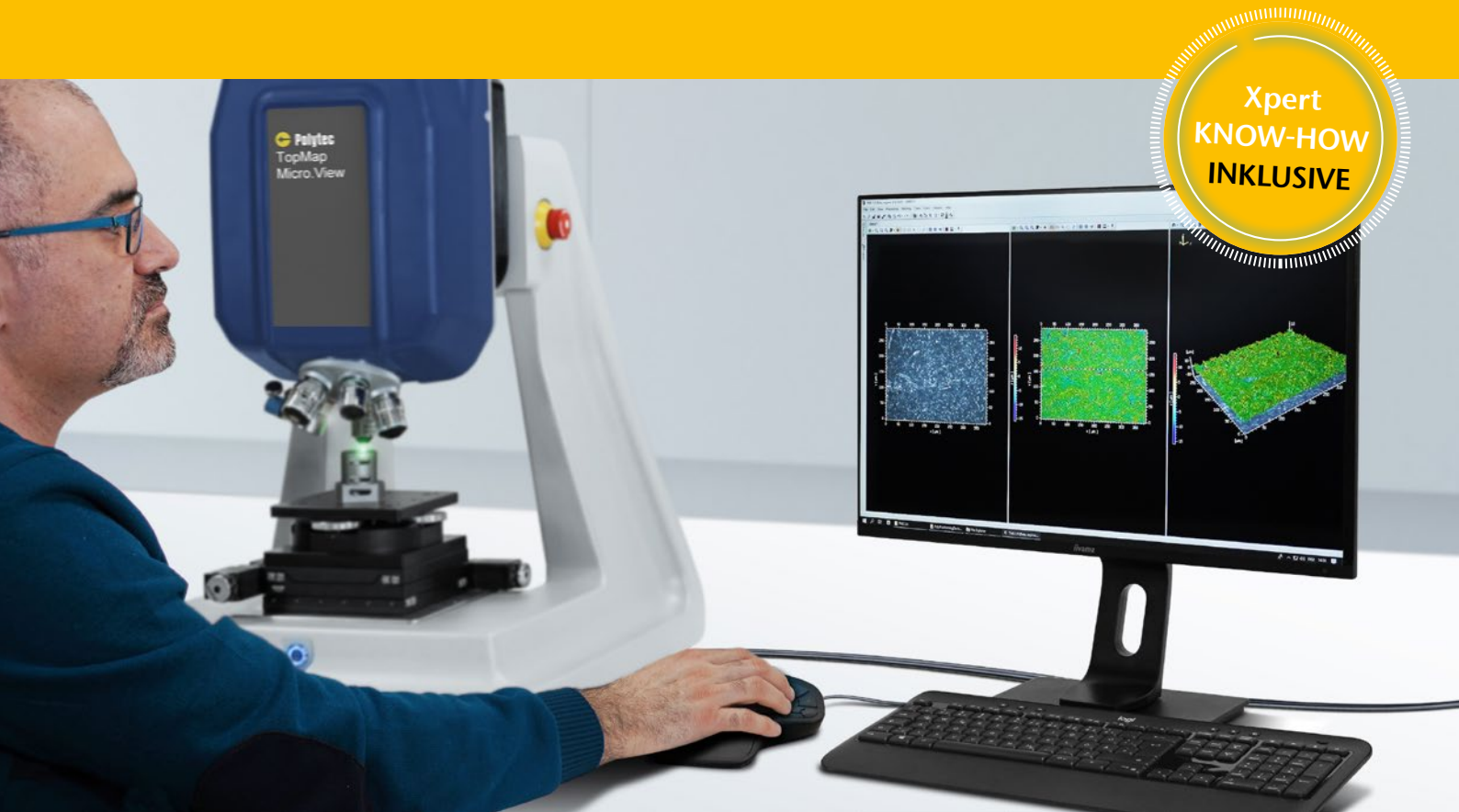
Gerade zur Charakterisierung technischer Oberflächen anhand Formabweichung, Rauheit, Textur oder Mikrostruktur setzt Polytec neue Maßstäbe. Seit 1967 widmet sich Polytec dem Vertrieb, der Entwicklung und Herstellung von optischen Technologien. Diese Kontinuität und Innovationskraft spiegelt sich in der neuen optischen 3D-Oberflächenmesstechnik Micro.View® und Micro.View®+ wieder, konzipiert, um bei Präzisionsmechanik und Funktionsoberflächen die Rauheit, Mikrostrukturen sowie die Leistungsfähigkeit von Dichtflächen zu untersuchen. Diese optischen, also berührungsfrei prüfenden Messinstrumente unterstützen die Qualitätskontrolle bei der Einhaltung enger Fertigungstoleranzen und heben die Oberflächenanalyse auf ein neues Niveau anhand 3D-Messdaten.



Messen mit TopMap Weißlicht-Interferometern

- Berührungsfrei, zerstörungsfrei, reproduzierbar
- Flächenhafte Topographiedaten in 3D
- Hochgenau, zuverlässig und automatisierbar
- Sehr hohe laterale Auflösung
- Hervorragende vertikale Auflösung unabhängig von der Objektivvergrößerung

Innovative optische 3D-Messtechnik TopMap Micro.View® und Micro.View®+



Verlässlich, präzise, innovativ

Micro.View® und Micro.View®+ stellen die neueste Entwicklung an 3D-Profilometern dar. Focus Finder sowie Focus Tracker finden und behalten stets den optimalen Fokuspunkt und die CST Continuous Scanning Technology ermöglicht den gesamten vertikalen Verfahrweg von 100 mm komplett als Messbereich zu nutzen. Im Farbmodus lassen sich Defekte besser lokalisieren und dokumentieren für eine differenziertere Oberflächenanalyse anhand farbiger Hintergrundbilder. Erfassen Sie selbst feinste Oberflächendetails mit einer Auflösung im Sub-Nanometerbereich.



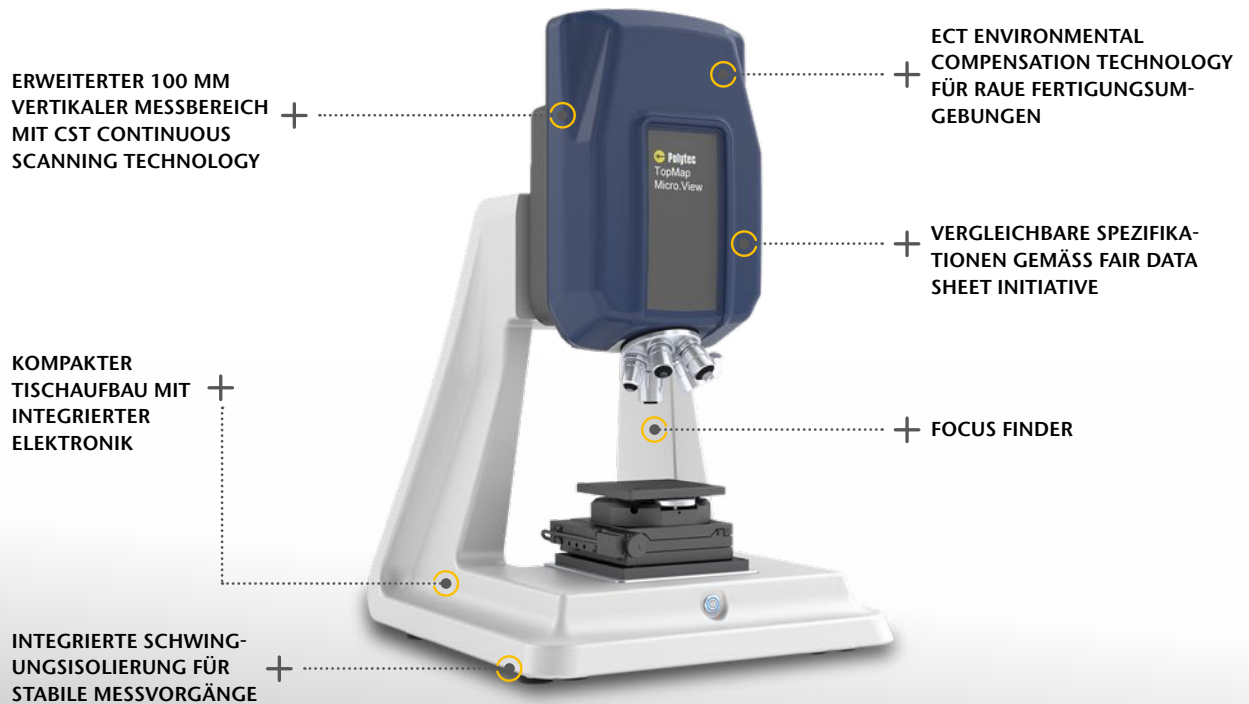
Erfahren Sie mehr über PolyXperts Leistungen, Beratung und Service in jeder Projektphase.

Mehr erfahren

polytec.com/microview

TopMap Micro.View®

Optisches Kompaktmessgerät für Oberflächendetails



Micro.View® ist das Kompaktsystem als Einstieg in die optische Messung von Rauheit und Mikrostrukturen. Auf bis zu 100 mm großem Z-Achse misst Micro.View® mit einer Auflösung im Nanometerbereich und dank integrierter CST Continuous Scanning Technology nutzt es den vertikalen Verfahrweg komplett als Messbereich. Der kompakte Tischaufbau mit integrierter Elektronik besticht durch seine Bedienerfreundlichkeit mit Focus Finder für schnelle und einfache Messvorgänge.

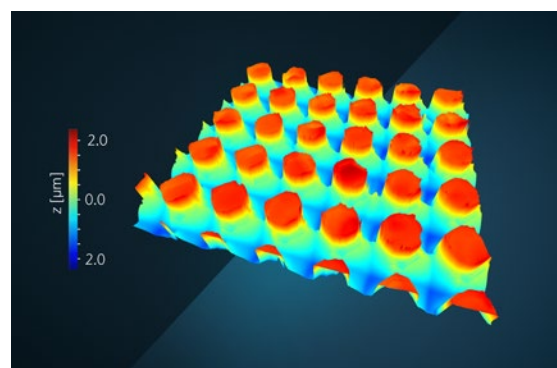
Kompakt und leistungsfähig

Die optionale ECT Environmental Compensation Technology stellt zuverlässige, reproduzierbare Messergebnisse selbst in rauer Umgebung sicher. Micro.View® ist die kosteneffiziente Lösung für die Qualitätskontrolle von Präzisionsmechanik und Analyse von Oberflächendetails sowohl in der Forschung als auch im Produktionsumfeld.



Highlights

- Kompaktsystem für Oberflächendetails mit nm Auflösung
- 100 mm vertikaler Messbereich mit CST Continuous Scanning Technology
- Kosteneffiziente Messtechnik-Lösung für die Qualitätskontrolle



TopMap Micro.View[®] +

Modulare optische 3D-Messstation für Rauheit und Mikrostrukturen

ERWEITERTER 100 MM
VERTIKALER MESSBEREICH
MIT CST CONTINUOUS
SCANNING TECHNOLOGY

DETAILLIERTE ANALYSE
MIT NM-AUFLÖSUNG IM
FARBMODUS

QC PACKAGE VEREIN-
FACHT FERTIGUNGS-
KONTROLLEN

5 MP-KAMERA FÜR
GESTOCHEN SCHARFE
3D-MESSDATEN

MOTORISIERTER
REVOLVER

FOCUS FINDER +
FOCUS TRACKER

VOLLMOTORISIERTE
PROBENPOSITIONIERUNG
(X, Y, KIPPEN)

Micro.View[®]+ ist die neue Generation optischer 3D-Profilometer. Als modulare Messstation bietet sie Konfigurationsmöglichkeiten und viele Freiheitsgrade für die verlässliche, hochgenaue Prüfung selbst feinsten Oberflächendetails wie Rauheit, Textur und Mikrostrukturen. Flächenhafte 3D-Messdaten sowie Farbdarstellungen erlauben aussagekräftige Visualisierungs- und Analyseformen sowie die professionelle Dokumentation von Defekten. Die 5 MP-Kamera nimmt 3D-Messdaten bis ins letzte Detail auf.

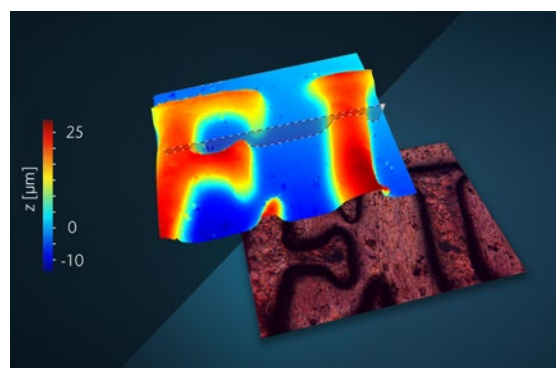
Vielseitig, automatisierbar und für in-line Inspektionen

Umfangreiches Zubehör erleichtert und beschleunigt die Messvorgänge signifikant. Während Focus Finder und Focus Tracker Prüflinge unter allen Umständen stets im Fokus behalten, unterstützen voll-motorisierte Positioniereinheiten das Stitching und automatisierte Prüfprozesse.



Highlights

- High-end-Weißlichtinterferometer mit nm Auflösung
- Focus Finder und Focus Tracker ideal für automatisierte Fertigungskontrollen
- Kein Nachpositionieren dank motorisierter Tip-Tilt Stage und Revolver



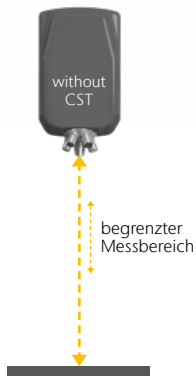
Präzision durch Innovation

01

CST Continuous Scanning Technology

Für eine kontinuierliche Erfassung der Höhendaten, erlaubt die CST Continuous Scanning Technology den gesamten Verfahrensweg von 100 mm als vertikalen Messbereich auszunutzen. Die präzise Z-Achse bietet mehr Freiheiten beim Positionieren, beschleunigt die Messvorbereitungen und ist wartungsarm.

Z Positionierung



Verfahrensweg = Messbereich



Höchste Flexibilität



Vorteile

- **Erweiterter Messbereich**
Datenerfassung auf gesamtem Verfahrensweg
- **Präzise Z-Achse**
Fokussierung und Messung in einem
- **Erweiterter Verfahrensweg**
Zum Messen großer Prüflinge

03

Modularität und Konfigurationen

Da die Messbedingungen variieren können, bietet das Micro.View®+ im modularen Konzept bewusst diverse Freiheitsgrade, um beispielsweise bis zu 370 mm hohe Prüflinge aufnehmen zu können. Für automatisierte Fertigungskontrollen lässt sich der Messkopf auch direkt in die Produktionslinie integrieren.



TopMap Micro.View®

TopMap Micro.View®+



Focus Tracker

Focus Finder und Focus Tracker behalten das Messobjekt stets im Fokus. Mit dem voll motorisierten Zubehör für die präzise Positionierung in X, Y, Z sowie der Kippplattform behält der Focus Tracker stets den eingestellten Fokus und gewährleistet wiederholbare und reproduzierbare Messergebnisse.

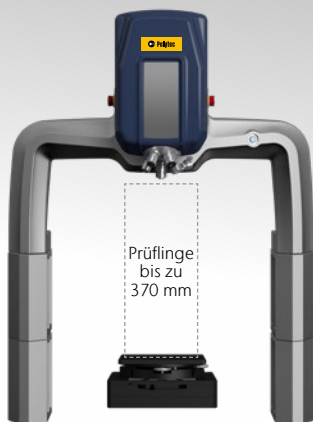


Fokus Tracker folgt der Messposition



Vorteile

- **Prüfling stets im Fokus dank automatischer Nachführung**
spart manuelles Neupositionieren
- **Vollmotorisierter Revolver sowie XYZ- und Kippbewegungen**
für reproduzierbare Messungen



Vorteile

- **Micro.View®:**
Kompakter Tischaufbau sofort einsatzbereit
- **Micro.View®+:**
 - Modulares Konzept, höhenadaptiv für große Prüflinge bis 370 mm
 - Messkopfintegration für In-line-Fertigungskontrollen leicht gemacht

Integration in Produktionslinien

TMS-Software als Komplettlösung aus einer Hand

Erweitert um die Einbindung eines Barcode-Scanners werden Prüfaufgaben im industriellen Umfeld unkompliziert und automatisiert erledigt. Die umfangreiche TMS-Software (Topographie Messsystem-SW) bietet eine Vielzahl von Optionen, die bedienerfreundliche, intuitive Qualitätskontrolle ermöglichen. Das neueste

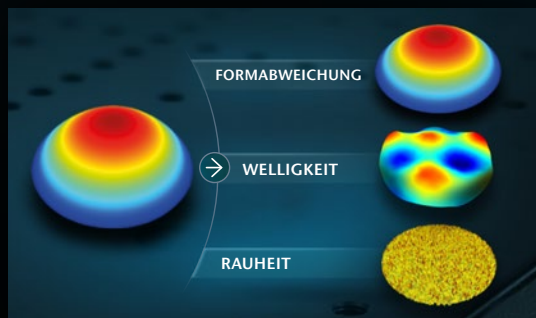
Software-Paket erlaubt die Datenerfassung hochauflöser Messdaten mit umfangreichen Auswertemöglichkeiten, um die relevante Kenngrößen anschaulich darzustellen. Vordefinierte Messrezepte erlauben Routine-Prüfvorgänge gar als Ein-Klick-Lösungen.

Datenerfassung

-  **POSITIONIERUNG**
-  **SCANNEN**
-  **BELICHTUNG**
-  **SIGNAL**

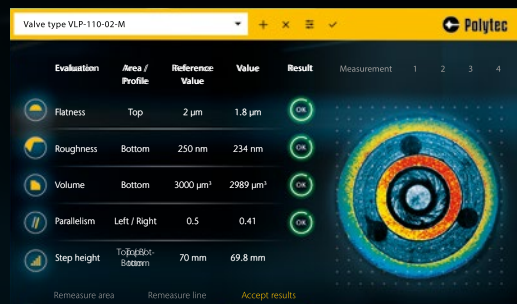
Schrittweises Einrichten für wiederholbare Messvorgänge und rückführbare Ergebnisse. Erzeugen, Abspeichern und Aufrufen von Messeinstellungen leicht gemacht.

Datenauswertung



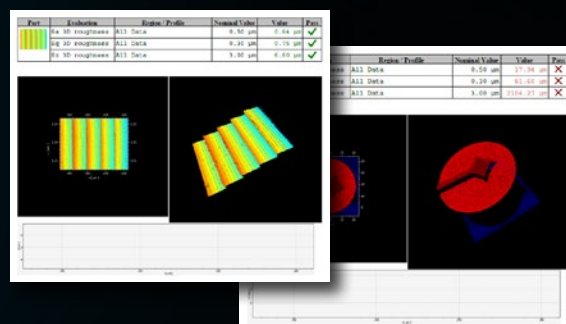
Oberflächen in 3D und flächenhaft anhand umfangreicher Parameter (inklusive ISO 25178) charakterisieren und die zugrundeliegenden Einstellungen als Entscheidungskriterien heranziehen.

Einfache Kundenanpassungen und Prozessintegration durch unterstützende Software-Entwicklung von Polytec



Vordefinierte Messrezepte reduzieren die Komplexität und ermöglichen eine intuitive Bedienung. Das QC Operator Interface ist ideal für Routine-Qualitätskontrollen und wiederkehrende Messaufgaben..

Automation



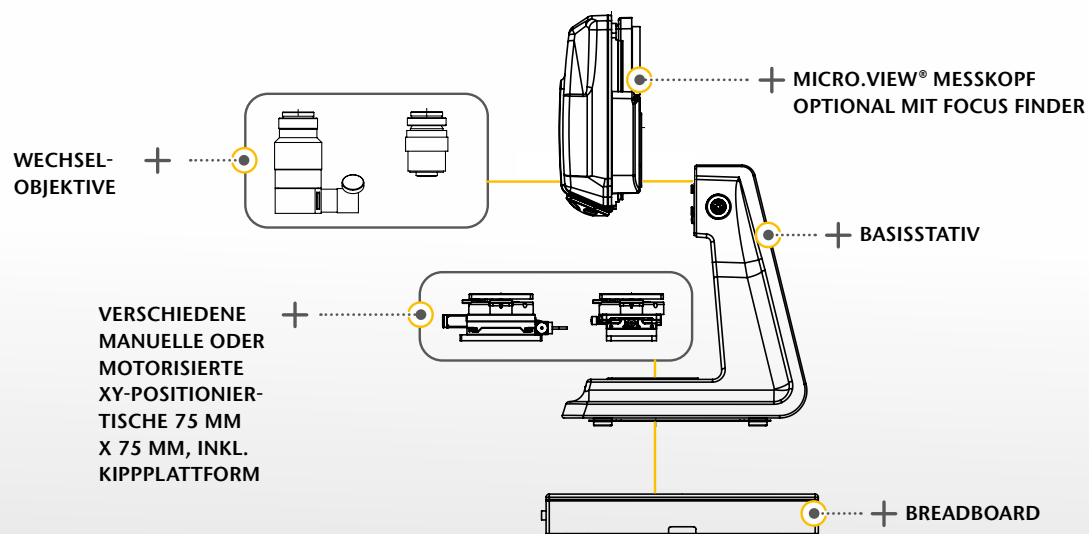
Prüfberichte auf Knopfdruck erstellen mit der kompletten, eigenen TMS-Software von Polytec. Nachvollziehbar dokumentierte Schritte zu Messung und Auswertung gewährleisten dabei Transparenz und Rückführbarkeit.

Reporting

Konfigurationen

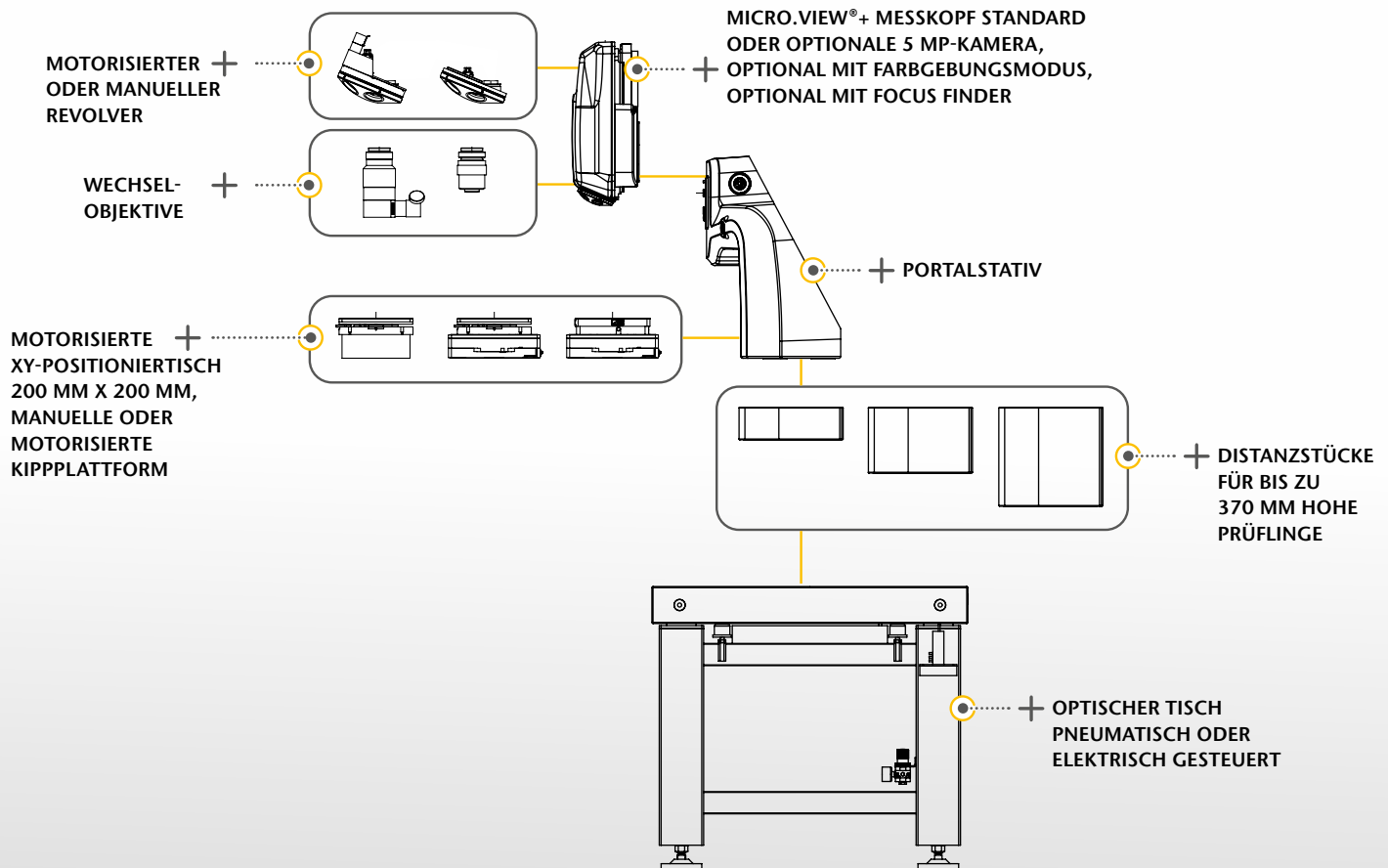
Micro.View®

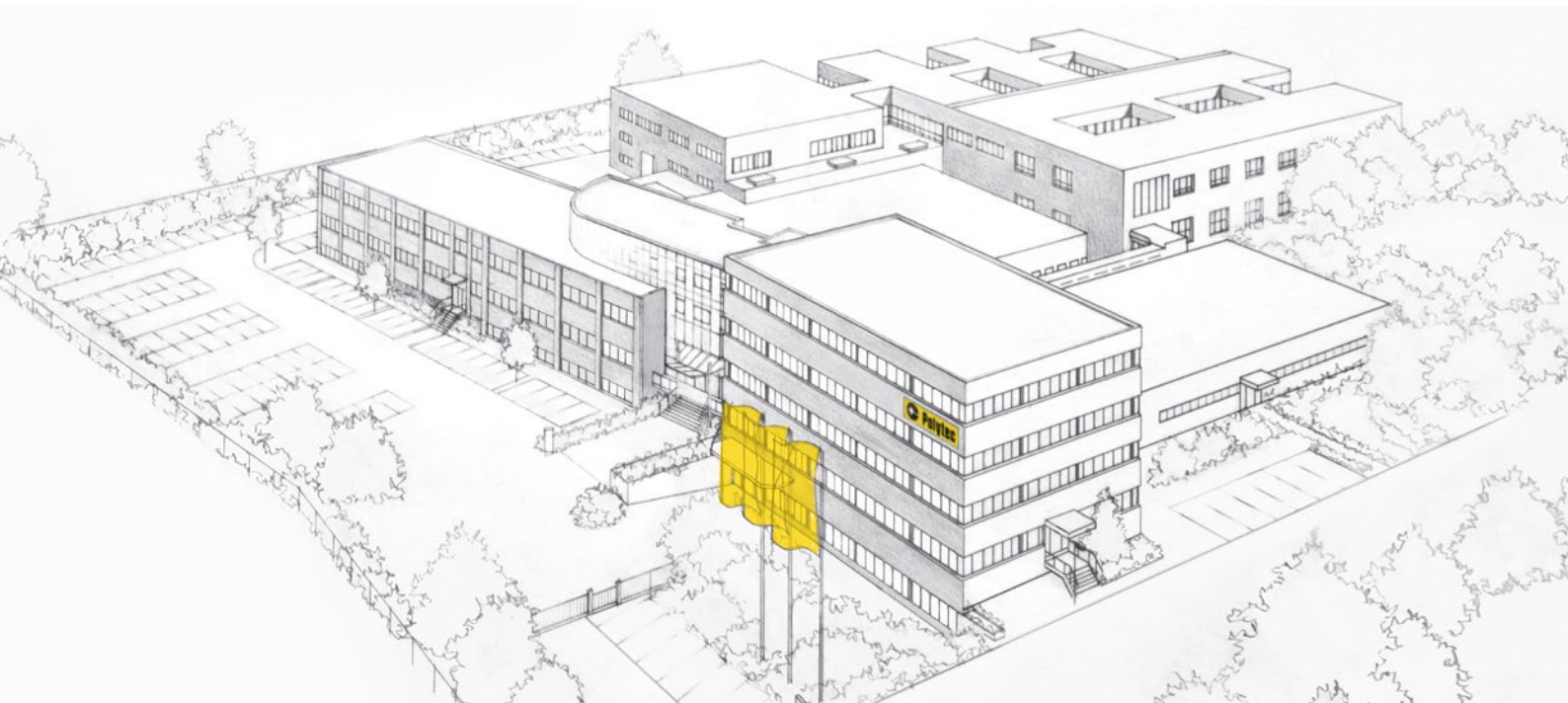
Kompakter Tischaufbau



Micro.View®+

Modulare 3D-Messtation für umfangreiche Oberflächenanalysen





Zukunft seit 1967

Hightech für Forschung und Industrie.
Vorreiter. Innovatoren. Perfektionisten.

Den Ansprechpartner für Ihre
Region finden Sie unter:
www.polytec.com/contact

Polytec GmbH

Polytec-Platz 1-7 · 76337 Waldbronn
Tel. +49 7243 604-0 · info@polytec.de